

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11311-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 10.12.2020 Ausstellungsdatum: 13.01.2021

Urkundeninhaber:

RJL Micro und Analytic GmbH
Im Entenfang 11, 76689 Karlsdorf-Neuthard

Prüfungen in den Bereichen:

Untersuchungen zur technischen Sauberkeit von Bauteilen und Komponenten , automatische Teilchenanalytik (Anzahl, Größe und chemische Zusammensetzung) mittels computergesteuerter REM-Rasterelektronenmikroskopie und EDX-Elementanalyse; Röntgen-Mikrotomographie und digitale Radiographie

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11311-01-00

1 Untersuchungen zur technischen Sauberkeit von Bauteilen und Komponenten *

ISO 16232 Road vehicles - Cleanliness of components and systems

2018-12

VDA 19 Teil 1 Prüfung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigung

2015-03 funktionsrelevanter Automobilteile

2 Automatische Teilchenanalytik (Anzahl, Größe und chemische Zusammensetzung) mittels computergesteuerter REM-Rasterelektronenmikroskopie und EDX-Elementanalyse

Hausverfahren Elektronenoptische Untersuchungen von Oberflächen und Partikelfiltern

PSEM-AFS-01 mittels Rasterelektronenmikroskop und EDX-Elementanalyse mit

2006-01 integrierter Auswertungssoftware

3 Röntgen-Mikrotomographie und digitale Radiographie

Hausverfahren Röntgen-Mikrotomographie und digitale Radiographie zur Ausbildung MCT-DXR und Analyse der inneren und äußeren räumlichen Struktur von Werk-

2014-09 stoffen, Komponenten und Produkten

verwendete Abkürzungen:

ISO International Organisation for Standardisation

VDA Verband der Automobilindustrie

Hausverfahren der RJL Micro und Analytic GmbH

Gültig ab: 10.12.2020 Ausstellungsdatum: 13.01.2021